

# RM3545A 測試線選擇指南

## RM3545A的測試線

為了對應各式各樣的測量對象、本指南列出七種類的測試線。  
請確認測量對象的形狀和接觸的作業性能，選擇最適合的組合。

### 針型測試線L2100

只要接觸測量對象就能進行4端子測量。  
前端設有彈簧伸縮式探針可以安定的進行接觸檢查。  
SOURCE Pin與SENSE Pin中間設有適度的間隔，相當適合低電阻測量。

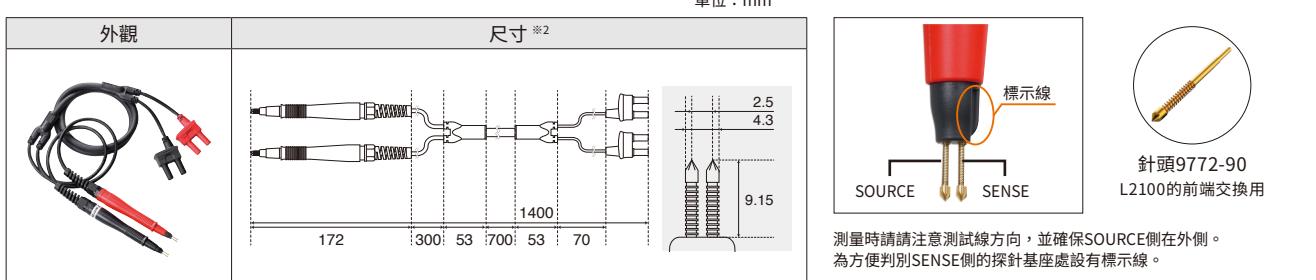
低電阻測量用 <sup>※1</sup>

探針間隔2.5 mm

※1：低電阻：測量電流為100 mA以上和下個量程。除此之外的量程不保證精度。

1000  $\mu\Omega$  量程 (HIGH, LOW)、10 m $\Omega$  量程 (HIGH, LOW)、100 m $\Omega$  量程 (HIGH, LOW)、1000 m $\Omega$  量程 (僅HIGH)

單位：mm



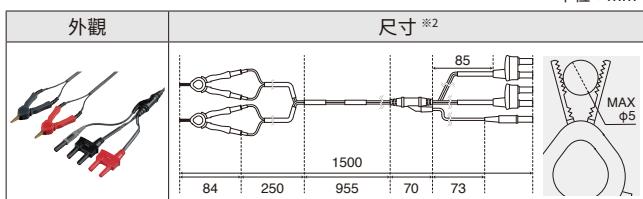
L2100沒有保護端子。測量高電阻時，請使用以下具有保護端子的測試線。

### 夾型測試線L2101

只要夾取測量對象就可以進行4端子測量。  
作業者可以離手，在測量中需要進別的作業時非常方便。  
測量電流100 mA為以上的低電阻量程的話推薦使用L2100。

可夾取的線徑0.3 mm～5 mm

單位：mm



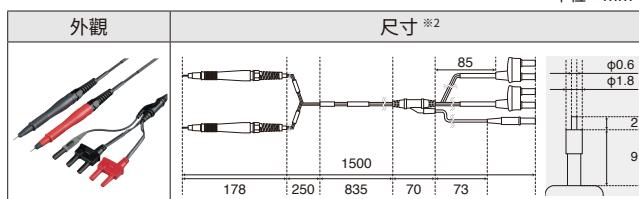
### 針型測試線L2102

只要接觸測量對象就能進行4端子測量。  
適合無法夾取的平面的端子或可以接觸的範圍內的微小測量對象。

探針的直徑  $\phi 1.8$  mm

探針的間隔 0.6 mm

單位：mm

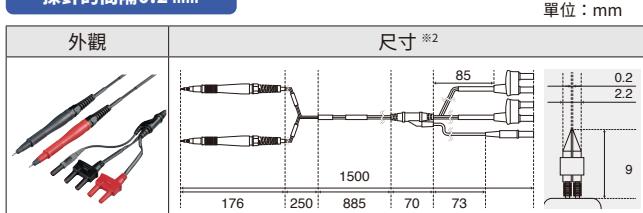


### 針型測試線L2103

只要接觸測量對象就能進行4端子測量。  
適合接觸的範圍內的微小測量對象。

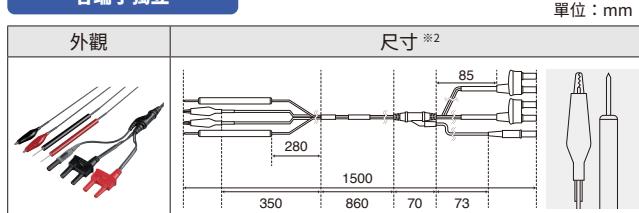
探針的間隔0.2 mm

單位：mm



各端子獨立

單位：mm



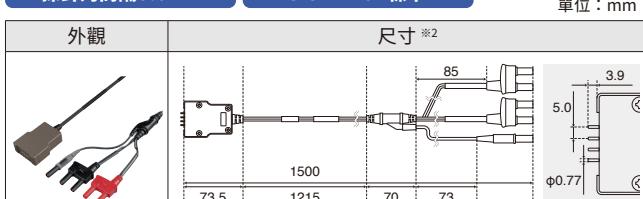
### 4探針探棒RM9010-01

使用專用PC軟體，將探棒壓在被測物上，就可以使用4探針法測量電阻率與導電率。便於導電性薄膜材料的評價。

探針的間隔5.0 mm

JIS K 7194標準

單位：mm

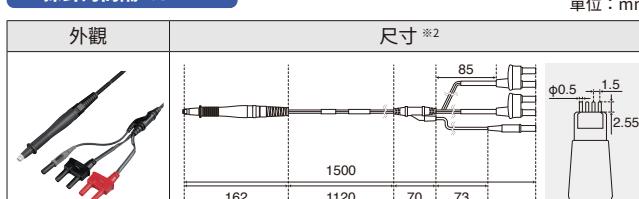


### 4探針探棒RM9010-02

使用專用PC軟體，將探棒壓在被測物上，就可以使用4探針法測量電阻率與導電率。便於導電性薄膜材料的評價。

探針的間隔1.5 mm

單位：mm



※2：全長以外的尺寸包含參考值。

© 2023 HIOKI E.E. CORPORATION

HIOKI

具體資料等以產品實際為準，如有變動，台灣日置電機股份有限公司具有最終變更權

2025年05月第一版/2505